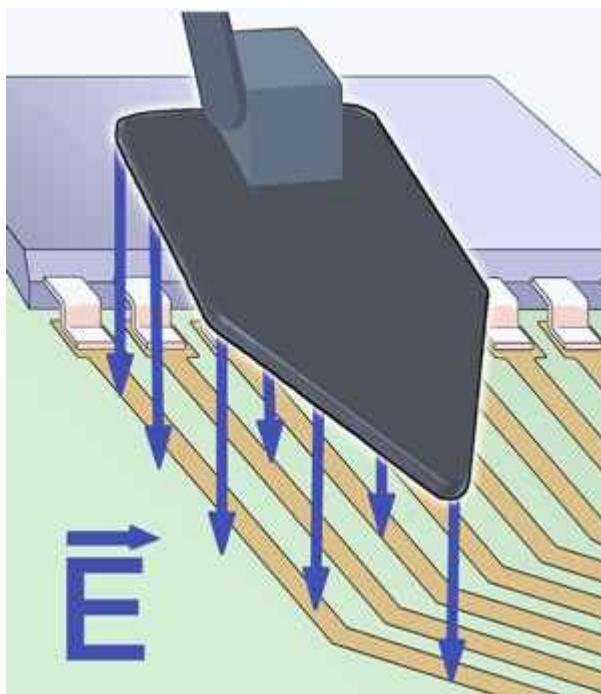


Kurzbeschreibung

Die Fläche des Feldquellenkopfes ermöglicht das großflächige Einkoppeln in Gehäuseoberflächen und Innenbereiche, Verbindungstechnik und Baugruppen mit Leiterzugstrukturen und ICs (z.B. Bussysteme, LCD-Displays). Des Weiteren kann sie mit ihrer Spitze zum Lokalisieren E-Feld-sensibler kleiner Schwachstellen verwendet werden (Leiterzüge, Quarze, Pull-up Widerstände, ICs).

Die Auflösung der ES 02 ist höher als die der Feldquelle ES 01.

Messprinzip



Anwendung ES 02

